سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:

بررسی خواص لایه های نازک اکسید اینیدیم آلاییده با قلع و مقایسه نتایج به دو روش بیضی سنجی و کرامرز-کرونیگ

محل انتشار:

دومین همایش ملی مهندسی مواد (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

داود رئوفی - *گروه فیزیک, دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان, خیابان مهدیه, همدان*

علی جمشیدی - *گروه فیزیک, دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان, خیابان مهدیه, همدان*

خلاصه مقاله:

اندازه گیری ضرایب اپتیکی (ضرایب شکست و خاموشی) از جمله مباحث مهم نانو ساختارها است. روشهای متعددی وجوددارند که می توان بوسیله آنها ضرایب اپتیکی را اندازه گیری کرد. از جمله این روش ها می توان روش کرامرز -کرونیگ و بیضیسنجی را نام برد. در این مقاله با استفاده از این دو روش ضرایب اپتیکی نانو ساختار های اکسید ایندیم آلاییده با قلع که درضخامت های 134،145 و 290 نانومتر به روش تبخیر با پرتو الکترونی بر روی زیر لایه شیشه ای و در شرایط یکسان تهیه شدهاند را بررسی می کنیم و نتایج را مقایسه می کنیم.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

https://civilica.com/doc/351851